

岩通パワエレ計測

「GaN/SiC スイッチング波形観測のトラブルと解決法セミナー in東京」のご案内

イベント名称	岩通パワエレ計測「GaN/SiC スイッチング波形観測のトラブルと解決法セミナー in東京」
人数	<b>先着15名様（終了しました）</b>
開催日時	2018年12月14日（火） 13:30～16:00（13:00 受付開始）
開催場所	〒168-8501 東京都杉並区久我山1-7-41 <b>「岩崎通信機 本社」 研修室</b> ※京王井の頭線 久我山駅から徒歩10分
プログラム	<p>13:00～ 受付開始</p> <p>13:30～ <b>セミナー</b></p> <p><b>1. 「電圧プロービングと電流プロービング」</b>          高分解能で電圧測定する場合の課題          電流センシング4種比較</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>ホール素子、シャント抵抗、広帯域シャント抵抗、CT 波形比較</li> <li>小型モジュールの測定事例</li> <li>広帯域の電流・電圧計測の課題</li> </ul> <p><b>2. 「電力損失測定の高精度化」</b>          電力アナライザの測定限界          電力校正体系（カロリメータ法/ ISO17025）          デジタイザ、オシロスコープによる測定限界          スキュー調整の重要性</p> <p><b>3. 「電力損失測定の高精度化」</b>          動的・静的特性</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>スイッチング損失、I-V 特性、C-V 測定などの事例</li> </ul> <p><b>4. 「測定相談会」</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>事前に相談内容をinfo-tme@iwatsu.co.jp宛てに件名を「岩通パワエレ 計測in東京 相談内容」にてお送りください。</li> </ul>